

1. Record Nr.	UNISA996280069103316
Titolo	2018 IEEE 27th Asian Test Symposium : 15-18 October 2018, Hefei, China // IEEE Computer Society
Pubbl/distr/stampa	Piscataway, New Jersey : , : Institute of Electrical and Electronics Engineers, , 2018
ISBN	1-5386-9466-2
Descrizione fisica	1 online resource (79 pages)
Disciplina	621.3815
Soggetti	Electronic digital computers - Testing - Circuits Electronic circuits - Testing Fault-tolerant computing
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia